

PRESSEMITTEILUNG

Hochkonzentrierte Dispersionen und gepackte Sedimente „durchleuchtet“ – LUM erweitert Applikationsfelder mit bauartenzugelassenem LUMiReader X-Ray

Bundesamt für Strahlenschutz erteilt Bauartenzulassung für Separationsanalysator

Berlin, 15.10.2013: Das Bundesamt für Strahlenschutz hat mit dem Schreiben vom 2. August 2013 die Vorrichtung Separationsanalysator als Vollschutzgerät gemäß §2 Nummer 25 als Bauart zugelassen, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 18.9.2013, BAnz AT 18.09.2013 B4. Unter dem Namen LUMiReader X-Ray wird dieses Analysegerät vom Zulassungsinhaber L.U.M. GmbH, Berlin produziert und verkauft.

Der innovative Separationsanalysator LUMiReader X-Ray erweitert die proprietäre Nah-Infrarot-STEP-Technologie nach der Ergänzung um sichtbares Licht nun auch auf Röntgenstrahlung, um das Entmischungsverhalten von hochkonzentrierten, lichtundurchlässigen Suspensionen und Emulsionen für einen breiten Partikelgrößenbereich unter Originalbedingungen (keine Verdünnung) experimentell erfassen zu können.

„Dies ist für uns ein echter ‚Quantensprung‘ in eine neue Welt – die Röntgentechnik“, freut sich Prof. Dr. Lerche, Geschäftsführer von LUM GmbH. „Die Vorteile des LUMiReader X-Ray liegen in der direkten und kontaktfreien Messung von Proben höchster Konzentration, der Bestimmung von Konzentrationsgradienten in Nano- und Mikrodispersionen und Sedimenten und der Bestimmung der zeitlich und orts aufgelösten Massenkonzentration dispergierter Phasen infolge von Separationsphänomenen. Selbst der Verlauf von Packungsdichten in Sedimenten und Filterkuchen lässt sich analysieren.“

Ob Lösungsmittel, Öl oder Wasser – alle Dispergiermedien sind möglich. Entsprechend beständige, unterschiedliche Messzellen sind verfügbar.

Der LUMiReader X-Ray ist die ideale Ergänzung zu den bewährten LUM-Messgeräten für Dispersionen, da die identischen Messzellen z.B. erst im LUMiSizer, LUMiFuge oder LUMiReader PSA optisch vermessen und danach noch im LUMiReader X-Ray zusätzlich analysiert werden können. Zu den Vorteilen der direkten und beschleunigten



Stabilitätsanalytik und Partikelcharakterisierung mit Nahinfrarot- bzw. sichtbarem Licht kommt so die qualitative und quantitative Bestimmung von Konzentrationsprofilen in separierten, entsprechend hochkonzentrierten Phasen hinzu.

LUM GmbH, Justus-von-Liebig-Str. 3, 12489 Berlin, Tel. +49-30-6780 6030,
Fax +49-30-6780 6058, info@lum-gmbh.de, www.lum-gmbh.com